

	DIN V VDE V 0126-18-4-1 (VDE V 0126-18-4-1)	DIN
	Dies ist zugleich eine VDE-Vornorm im Sinne von VDE 0022. Sie ist unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.	VDE
<p>ICS 27.160</p> <p style="text-align: center;">Vornorm</p> <p>Solarscheiben – Teil 4-1: Verfahren zur Messung der elektrischen Eigenschaften von Siliciumscheiben – Effektive Minoritätsladungsträgerlebensdauer, Inline-Messmethode</p> <p>Solar wafers – Part 4-1: Process for measuring the electrical characteristics of silicon wafers – Minority carrier lifetime, Inline measuring method</p> <p>Poulies solaires – Partie 4-1: Mesures des caractéristiques électriques des poulies de silicium – Durée de vie effective des porteurs minoritaires, méthode de mesure en ligne</p> <p style="text-align: right;">Gesamtumfang 6 Seiten</p> <p style="text-align: center;">DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE</p>		

– Vornorm –

DIN V VDE V 0126-18-4-1 (VDE V 0126-18-4-1):2007-06

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Bestimmung der Ladungsträgerlebensdauer	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Probenpräparation	4
4.3 Messparameter.....	5
5 Auswertung.....	5
6 Prüfbericht	6
 Bild 1 – Messbereich der Siliciumscheibe	 5